関連装置:集束イオンビーム加工観察装置(FIB)

# FIB による TEM 試料作製法 1

#### ピックアップ法

#### 1.はじめに

本解説では FIB によるガラスマニピュレータ による TEM 試料作製法について紹介する。事前に 素材を TEM の試料ホルダに挿入できない場合は 切り出しの手間に多くの時間を要する。また、試 料のほとんどが失われてしまいます。そこで素材 の必要な部分のみ FIB で薄膜加工、切り離し用光 学顕微鏡に取り付けられたマニピュレータの先 端に取り付けられたガラスプローブでピックア ップしカーボンなどの支持膜上に載せるピック アップ法が現在では主流となっている。以降、ピ ックアップ法の具体的な手順について紹介する。



#### Fig.1 ピックアップ法の概略

ピックアップ法はあらかじめ FIB で薄膜を作 製、分離する。その後、試料を大気中に取り出 しマニピュレータ先端のガラスプローブにより 薄膜部分を取り出し、支持膜を張ったメッシュ 上に搬送する。メッシュには複数枚の試料を載 せることができる。

#### 2. 具体的手順

FIB による TEM 試料作製法の一つとしてピック アップ法がある。ダイシング法と比較すると、事 前の予備加工を必要としない特徴をもつ。ピック アップ法の手順の概略は次の通りである。

- ① FIB による薄膜加工(分離加工する)。
- ガラスプローブの作製(ピックアップシステムマイクロフォージ、マイクロピペット作製器)。
- ③ ピックアップ (マニピュレータ)。

ピックアップシステムは

- 1) マイクロピペット作製器: PC-10 (Fig. 2-1)
- 2) マイクロフォージ:MF-900(Fig. 2-2)
- 3) マニピュレータ顕微鏡(Fig. 2-3)

より構成されている。1)、2)はガラスプローブ 作製のための機器であり、3)はFIB で加工され た薄膜の部分をピックアップするためのマニ ピュレータを備えた光学顕微鏡である。



Fig. 2-1 プローブ作製装置

ガラス棒を加熱しながら引っ張り、切断する装置 写真左:装置全体 右:ヒーター部分



Fig. 2-2

切断されたガラス棒の先端を加熱し表面積を 増やし、ガラスプローブを作る装置

```
写真左:装置全体、右:ヒーター部分
```





#### Fig. 2-3 ピックアップシステム

左はピックアップシステム全体、右はマニピュレ ータ部分の拡大

(1)薄膜加工

FIBにより試料の目的位置をあらかじめ薄膜加 工しておく。ピックアップ法による TEM 試料作製 の場合、ダイシングなどの事前加工の必要は無い が、薄膜部分をガラスプローブによりピックアッ プするため、薄膜部分を母体よりあらかじめ分離 しておく必要がある。次に示す方法でピックアッ プのための試料薄膜加工を行う。

- FIB チャンバに試料をセットし、希望する部分の薄膜加工を行うが、最終的に薄膜を分離するために、Fig. 2-4 に示す通り膜厚が 0.5~1µm程度であらかじめボトムカット(試料を60°傾斜し、薄膜部分の底部にイオンビームにより切りこみを入れておく)する必要がある。
- ② 試料傾斜を水平に戻し、さらに加工を行い膜
  厚 0.1 µ m以下まで薄膜化する(Fig. 2-5 左)。
- ③ 薄膜化完了後、薄膜のサイドカット(薄膜左 右両辺をイオンビームにより切りこみを入 れる)を行い、試料母材から完全に切り離す (Fig. 2-5 右)。その後、試料を FIB チャンバ より取り出し、ピックアップシステムの光学 顕微鏡のステージに移す。

### 関連装置:集束イオンビーム加工観察装置(FIB)



#### Fig. 2-4 ボトムカット

膜厚が 0.5~1μmで試料を 60 度傾斜し、薄膜部 分の底部にイオンビームにより切りこみを入れる (ボトムカット)



#### Fig. 2-5 切り離し加工

試料傾斜を水平に戻し、さらに膜厚が 0.1μ m以 下になるまで薄膜化する(左)。その後、薄膜の両辺 をイオンビームによりサイドカットし、試料母材よ り完全分離する

(2)薄膜のピックアップ

#### ・プローブの作製

薄膜のピックアップを行う前に、あらかじめガ ラスプローブを作製しておく必要がある。次に示 すの手順でガラスプローブの作製を行う。

- (1) 付属のガラス棒をマイクロピペット作製器 (PC-10) に取り付ける(Fig. 2-6)。
- スタートボタン(赤いボタン)を押すとヒー ターに通電され、ガラス棒が伸びる(Fig. 2-7 左)。
- ③ ストッパにより、ガラス棒が完全に切断され る前に停止する(Fig. 2-7 中)。
- ④ ストッパが外れ、再度ヒーターに通電され、



ガラス棒が切断される(②~④までの動作は 自動で連続に行われる)。切断されたガラス 棒の先端をプローブとして用いる(Fig. 2-7 右)。

- ⑤ 切断されたガラス棒をホルダーに取り付け (Fig. 2-8,9)、マイクロフォージ(MF-900) に取り付ける(Fig. 2-10)。この時、付属の光 学顕微鏡によりヒーターの先端にガラス棒 の先端をあわせる(Fig. 2-11)。
- ⑥ 光学顕微鏡を観察しながらフットスイッチで
  ヒーターに通電し、ガラス棒の先端を丸め表
  面積を増やし、プローブとする(Fig. 2-12)。

以上の手順により、ガラスプローブの作製が完了 する。



Fig.2-6 プローブの作製1

付属のガラス棒を PC-10 に取り付ける



2回目の加熱 切断されたガラス棒

#### Fig. 2-7 プローブの作製 2

ヒーターに通電(左)すると、ガラスが伸び、切断 前にストッパで一旦停止する。ヒーターがガラス棒 の一番細い位置に移動して再度加熱が始まる(中)。 この時、ストッパは外れており、ガラス棒は切断さ





関連装置:集束イオンビーム加工観察装置(FIB)

*Fig. 2-8 プローブの作製3* ガラス棒を取り外す。



*Fig. 2-9 プローブの作製 4* ガラス棒をホルダーに取り付ける。



Fig. 2-10 プローブの作製 5 MF-900 にホルダーごとガラス棒を取り付ける

Fig. 2-11 プローブの作製 6





光学顕微鏡で観察しながらガラス棒の先端とヒ ーターの先端を合わせる。



#### Fig. 2-12 プローブの作製 7

フットスイッチによりヒーターに通電し、ガラス 棒の先端の表面積を増大させプローブとして使用 する

#### ・薄膜のピックアップ

前述の手順で作られたプローブをホルダーご とマニピュレータに取り付け、あらかじめ FIB に より作製された薄膜部分をピックアップし、支持 膜上に搬送し、TEM 観察する。次に示すの手順で ピックアップによる試料作製を行う。

- ガラスプローブをマイクロマニピュレータに 取り付ける (Fig. 2-13)。
- ② ガラスプローブの先端が光学顕微鏡像の中心 になるように調整する。
- ③ FIB であらかじめ加工した試料をステージに セットし、加工した場所が光学顕微鏡像の中 心になるように試料位置を調整する。油圧ハ

#### 関連装置:集束イオンビーム加工観察装置(FIB)

ンドルのZ軸(Fig. 2-14)と光学顕微鏡のフォ ーカス(微動)を操作し、ガラスプローブを 試料の FIB 加工した位置に近づける (Fig. 2-15)。

- ④ 光学顕微鏡の倍率 500 倍で観察しながら油圧 ハンドルの X, Y, Z を操作し、FIB の加工ボッ クスにガラスプローブの先端が入る (Fig. 2-16)ようにする(これよりガラスプロ ーブの操作は慎重に行う)。
- ⑤ 油圧ハンドルの X を操作し、ガラスプローブ
  を薄膜部分に接触させる(Fig. 2-17)。
- ⑥ 油圧ハンドルの Z を操作し、ガラスプローブの先端を、やや持ち上げる。ガラスプローブの先端に薄膜が接触しているのが確認できたら、さらに油圧ハンドルの Z を操作し、ガラスプローブを数センチ上へ持ち上げる。
- ⑦ ステージ上に(カーボン、コロジオンなどの 支持膜を貼った)メッシュを置き、光学顕微 鏡像の中心に置く(Fig. 2-18)。この操作を行 うときには、ガラスプローブの先端に試料が 付いているので注意が必要。
- ⑧ 光学顕微鏡を観察しながら油圧ハンドルの Z を操作し、メッシュの中心に向かってガラス プローブの先端を近づける(Fig. 2-19 左)。
- ⑨ 光学顕微鏡の倍率 500 倍で観察しながら油圧 ハンドルの X, Y, Z を操作し、ガラスプローブ の先端に付いている薄膜を支持膜表面に接 触させる(Fig. 2-19 中)。
- 11) 油圧ハンドルの Z を操作し、ガラスプローブ 先端をやや持ち上げる(Fig. 2-19 右)。
- 薄膜が支持膜上に載ったことが確認できたら 油圧ハンドルのZを操作し、ガラスプローブ を数センチ上へ持ち上げる。
- メッシュをピンセットで TEM ホルダーまで搬送し、セットする(Fig. 2-20)。
- TEM 観察を行う(Fig. 2-21)。





*Fig. 2-13 ピックアップ手順1* ガラスプローブをマニピュレータに取り付ける



*Fig. 2–14 ピックアップ手順 2* 油圧ハンドルでマニピュレータを操作する



Fig. 2-15 ピックアップ手順3

試料を光学顕微鏡のステージに置き、FIB 加工した位置が光学顕微鏡像の中心にくるように調整する

関連装置:集束イオンビーム加工観察装置(FIB)



Fig. 2-16 ピックアップ手順 4 ガラスプローブの先端が加エボックスの中に入 るように油圧ハンドルで調整する



Fig. 2-17 ピックアップ手順5

薄膜部分にガラスプローブの先端を接触させる。 薄膜部分がガラスプローブに完全に付いたことを 確認したら、ガラスプローブを数センチ上まで持ち 上げる。



Fig. 2-18 ピックアップ手順6 光学顕微鏡のステージに支持膜を貼ったメッシ ュを置く。この時、ガラスプローブの先端に試料が 付いているので、誤って接触しないように注意する



関連装置:集束イオンビーム加工観察装置(FIB)

## JEOL Application Data Sheet



#### Fig. 2-19 ピックアップ手順 7

油圧ハンドルを操作し、ガラスプローブの先端を 支持膜に近づける(左)。薄膜部分が支持膜に接触し、 ガラスプローブの先端から離れる(中)のを確認し、 ガラスプローブをメッシュから離す(右)。



*Fig. 2–20 ピックアップ手順 8* メッシュを TEM ホルダーにセットする



*Fig. 2-21 ピックアップ手順9(TEM 観察)* 試料:タングステンビア

